

2023 年

- [2023-J1\(C\)](#) インピーダンス計測プラットフォーム技術を用いた SiN 膜中トラップ特性の統計的計測
第 28 回電子デバイス界面テクノロジー研究会 (応用物理学会 薄膜・表面物理分科会, シリコンテクノロジー分科会 共催), pp.89-94, 2023 年 2 月 4 日, 静岡県三島市
齊藤宏河, 鈴木達彦, 光田薫未, 間脇武蔵, 諏訪智之, 寺本章伸, 須川成利, 黒田理人
<https://tsys.jp/oxide/2023/program.html>
- [2023-J2\(C\)](#) ランダムテレグラフノイズの MOS トランジスタ構造・動作条件依存性の統計的解析
第 28 回電子デバイス界面テクノロジー研究会 (応用物理学会 薄膜・表面物理分科会, シリコンテクノロジー分科会 共催), pp.141-145, 2023 年 2 月 4 日, 静岡県三島市
間脇武蔵, 黒田理人, 秋元瞭, 須川成利
<https://tsys.jp/oxide/2023/program.html>